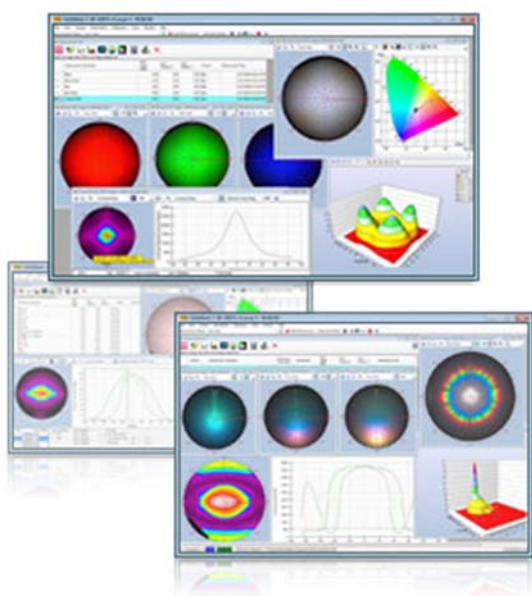


快速多视角 Imaging Sphere:

对光源、显示器和散射材料的完整角度性能信息进行经济高效而又快速的单次采集测量

我们的 Imaging Spheres 产品基于新颖的光学结构，可一次性从半球的所有角度对目标器件或材料进行同时成像测量。对比通过传统测角仪或锥光偏振仪测量解决方案，该系统能获得更快、更完整且更准确的测量结果。ProMetric 成像色度计（或光度计）用于采集图像数据，确保高精度测量。Imaging Sphere 可配置用于测量 LED 和其它小型光源的远场光强分布、测量显示器视角性能或测量表面散射光线的角分布（BRDF 和 BTDF）。对于 LED、FPD、显示器配件和材料表面分析等研发及生产应用，Imaging Sphere 是理想的选择。



典型应用:

- 显示元件和光学薄膜的散射测量
- 油漆、粉末和抛光剂等表面处理剂的散射测量
- LED 发光强度分布测量
- 小型光源发光强度分布测量
- 平板显示器的视角性能测量
- 计算机模拟和渲染的散射特性

Imaging Sphere 有三种基本模型可供选择，包含两种甚至三种所用的测量类型配置系统的选项:

IS-LI & IS-LI-TE

光强分布高速测量系统可针对 LED 和其它小型光源，提供远场发光强度、辐射强度、CIE 色坐标和相关色温（CCT）等关于角度分布的全面测量。IS-LI 可提供测试仪无法提供的重要方向性信息。

IS-VA

视角性能系统可高速、全面地测量平板显示器和显示器配件的色度、亮度和对比度等项目随视角的分布。IS-VA 在测量速度和系统成本方面可与锥光偏振仪和测角系统相媲美。

IS-SA

散射和外观测量系统集成了一个聚焦光源，可直接照射到材料样本上，以测量散射光。IS-SA 可准确、快速地描述各种反射表面和透光薄膜的表面粗糙度、缺陷和漫反射特性。比起测角仪系统，IS-SA 有更细小的角度分辨率和更快的测量速度，能生成详细的 BRDF 和 BTDF，而且它在配置测量方面具有更大的灵活性。

Imaging Sphere 软件

Imaging Sphere 配备强大易用的，基于 Imaging Sphere 软件引擎的 IS 1.x 仪器控制和分析软件。IS 1.x 软件可简化测量设置和控制，并可轻松访问各种图像分析功能，包括 2D 和 3D 图、直方图和图像差分。软件功能可以靠外部控件 ISEngine.Net (Framework 2.0) 来控制，因此用户可以使用 Visual Studio 2005 或其它兼容 .Net 的编程语言构建自定义测试和分析序列。